

لهم اخْرُجْنَا

٩٠٩٢



دانشگاه شیمی

پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی فیزیک

موضوع :

تهیه لایه نازک از نانو بلورهای کادمیم سلنید به روش حمام شیمیایی و تعیین
ویژگی های آن و بررسی عوامل موثر بر آن ویژگی ها

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر غفار متدين اول

نگارش :

مهدیه پور رضاییان خورسندي

۱۳۸۷ / ۰۷ / ۱۳

آسفند ۱۳۸۶

۴۰۹۳۰

لعدیم به

روح پر بزرگوارم که اندر زنای اور نسوان را هم بوده و هست

و مادر مهرباخم به پاس تمام محبت ها و از خود گذشتگی هایش.

و همسر عزیزم که در همه حال عاشقانه و صبورانه پشتیبان و همراه من بوده است.

بارالهای اکون که مرحله ناچیزی از مراحل صعود پله های علم و دانش را طی نموده ام خود را کوچکتر از آن می سینم که حرکتی به خود نسبت دهم، چرا که اگر تو نی خواستی من پنج نبوم اما اکون که تو خواستی پاس توراست و اید آن دارم که در راه تو قویتر از همیشه کام بردارم و بجز حقیقت و راستی نویم.

این رساله مرهون تلاش و مساعدت عزیزانی است که در این مجال بر خود لازم می دانم که از آنان قدر دانی نمایم:

- از جناب آقای دکتر غفار متدين اول که راهنمایی این پایان نامه را بر عهده داشتند کمال تشکر را دارم.
- از جناب آقای دکتر سهیلیان و جناب آقای دکتر آوانس که زحمت مطالعه و داوری این پایان نامه را پذیرا شدند بسیار سپاسگزارم.
- از تمامی معلمان و استادی که در طول دوران تحصیل از محضرشان کسب علم نموده ام خالصانه تشکر می کنم.
- از خانواده مهریانم که در تمام مراحل زندگی مشوق من بودند و هستند و دوستان عزیزم خانمها محدثه زارعی، رقیه نوروزی، لیلا کامل، پریسا نوروزی که با هم زیستیم و همیشه بر این باور بودیم که، تنها خوبیست که می ماند.
- از کمک های بی دریغ آقای دکتر صحرایی و آقای دکتر گودرزی و کلیه دوستان خوبم در آزمایشگاه شیمی فیزیک سپاسگزارم.
- در نهایت از تمامی کارمندان دانشکده شیمی بویژه خانم ها فراهانی، نور محمد کمال تشکر را دارم.

چکیده

CdSe یک نیمه رسانای نوع VI - II است. که شکاف انرژی آن، در دمای اتاق 175 eV است. این ترکیب یکی از مهم‌ترین مواد در تهیه قطعات اپتو الکترونیک و سلول‌های نوررسانا و سلول‌های خورشیدی است. در طی سال‌های اخیر لایه نازک کادمیم سلنید مورد توجه فراوان قرار گرفته است و به وسیله روش‌های مختلفی همچون تبخیر در خلا، افshan پیرولیز، سل‌ژل و لایه نشانی حمام شیمیایی (CBD)^۱ تهیه شده است. ویژگی‌های لایه نازک کادمیم سلنید تهیه شده به روش حمام شیمیایی (CBD) بر روی زیر لایه شیشه‌ای تحت تاثیر عوامل مختلف غلظت مواد تشکیل دهنده، pH و دمای آن می‌باشد. تهیه لایه نازک‌های کادمیم سلنید به زوشی حمام شیمیایی (CBD) معمولاً به طور نسبی در غلظت‌های بالایی از Cd^{2+} و در محیط‌های آمونیاکی انجام می‌گیرد. با توجه به نامطلوب بودن ورود یون‌های کادمیم موجود در پسابهای روش CBD به محیط زیست و فراریت آمونیاک و ورود آن به اتمسفر، در این تحقیق (پایان نامه) جهت بررسی امکان کاهش مشکلات زیست محیطی ناشی از لایه نشانی به روش CBD، از غلظت‌های پایین یون کادمیم استفاده شد و آمونیاک حذف گردید. لایه‌های حاصل از نانو بلورهای تهیه شده از کادمیم سلنید از کیفیت مناسبی برخوردار بودند.

در این پژوهه لایه نازک‌های کادمیم سلنید که در دماهای مختلف با نسبتهاي مختلف از غلظت لیگاند به کادمیم تهیه شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. طیف XRD، UV-Vis حاصل از لایه‌ها حاکی از آن است که لایه‌هایی با ساختار نانو بلوری و خواص ثوری متفاوت در دماهای متفاوت تهیه شدند. برای عامل کمپلکس کننده تری اتانول آمین، مناسب ترین مقدار از نسبت غلظت عامل کمپلکس کننده به غلظت کادمیم، و هم‌چنین محدوده مناسب از pH که منجر به تهیه

لایه هایی با کیفیت بسیار خوب شد تعیین گردید. لایه نازک های تهیه شده در دمای محیط بوسیله میکروسکوپ الکترونی - روشی (SEM) مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که دما اثرات بسیار مشهودی بر روی مورفولوژی سطح لایه نازک های کادمیم سلنید دارد. این نتایج همچنین نشان می دهند که اندازه دانه ها در لایه نازک با سرعت واکنش و سرعت رها شدن یونهای

Cd^{2+} و Se^{2-} با اندازه دانه ها در لایه نازک ارتباط مستقیم دارد.

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

فصل اول: تئوری

بخش اول: نیمه رساناهای

۳	۱-۱) رسانایی الکتریکی در مواد
۵	۱-۲) نیمه رساناها
۵	۱-۳) رسانایی الکتریکی در نیمه رساناها
۶	۱-۴) الکترونها و حفره‌ها
۷	۱-۵) نیمه رساناهای ذاتی
۹	۱-۶) نیمه رساناهای غیر ذاتی

بخش دوم: نیمه رسانای کادمیم سلنید

۱۳	۲-۱) اثر فوتو ولتاوی
۱۴	۲-۲) برخی خواص فیزیکی و شیمیایی کادمیم سلنید
۱۵	۲-۳) سلنیم و برخی خواص آن
۱۶	۲-۴) فلز کادمیم و اثرات زیست محیطی و بیو لوژیکی آن
۱۸	۲-۵) کاربردهای لایه نازک کادمیم سلنید

بخش سوم: مکانیسم روش حمام شیمیایی و مزایا و معایب آن

۲۲	۳-۱) روش‌های مختلف لایه نشانی
۲۳	۳-۲) مزایا و معایب لایه نشانی به روش حمام شیمیایی
۲۴	۳-۳) لایه نشانی به روش حمام شیمیایی
۲۵	۳-۴) مکانیسم لایه نشانی به روش حمام شیمیایی

بخش چهارم: عوامل موثر ویژگیهای لایه نازک کادمیم سلنید

۳۱	۴-۱) عوامل موثر بر خصوصیات لایه نازک های کادمیم سلنید
----	---

۳۱ ۱-۴-۱ دما
۳۲ ۲-۴-۱ pH اثر
۳۳ ۳-۴-۱ نسبت غلظت لیگاند به غلظت یون کادمیم
۳۵ ۴-۴-۱ نسبت غلظت سدیم سلنیو سولفات به غلظت یون کادمیم
۳۶ ۵-۴-۱ زیر لایه
۳۸ ۱-۴-۶ تاثیر افزودن ناخالصی به لایه ها
۳۹ ۷-۴-۱ تاثیر افزودن بافر به محلول
۳۹ ۸-۴-۱ ضخامت لایه نازک
۴۰ ۹-۴-۱ مدت زمان لایه نشانی

بخش پنجم: روش‌های مطالعه لایه نازک کادمیم سلینید

۴۳ ۱-۵) روش‌های مطالعه لایه نازک ها
۴۴ ۱-۵-۱ ضخامت لایه
۴۴ ۲-۵-۱ پراش پرتوهای ایکس (XRD)
۴۶ ۳-۵-۱ چسبندگی لایه های نازک
۴۶ ۴-۵-۱ میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
۴۷ ۵-۵-۱ تجزیه عنصری لایه نازک (EDX)
۴۷ ۶-۵-۱ طیف سنجی مرئی-فرابینفش

فصل دوم: تجربی

بخش اول: تهیه لایه نازک های کادمیم سلینید به روش حمام شیمیایی

۵۱ ۲-۱-۱) مواد مورد استفاده، عموما از شرکت Merk آلمان
۵۱ ۲-۱-۲) دستگاه ها
۵۲ ۳-۱-۲ آماده سازی حمام
۵۳ ۴-۱-۲ آماده سازی زیر لایه ها
۵۴ ۵-۱-۲ تهیه محلولهای به کار گرفته شده
۵۴ ۶-۱-۲ ظرف واکنش

۷-۱-۲	مراحل تهیه لایه نازک کادمیم سلنید.....	۵۰
۸-۱-۲	تهیه لایه نازک کادمیم سلنید در دمای C°.....	۵۷
۹-۱-۲	تهیه لایه نازک کادمیم سلنید در دمای محیط.....	۵۹

بخش دوم: بررسی های صورت گرفته روی لایه ها

۱-۲-۲	بررسی میزان چسبندگی بلورها.....	۶۱
۲-۲-۲	طیف سنجی مرئی - فرابنفش	۶۱
۳-۲-۲	میکروسکوپ الکترونی روبیشی (SEM)	۶۲
۴-۲-۲	پراش پرتوهای ایکس (XRD)	۶۲

فصل سوم: نتایج بررسی های انجام شده

۱-۳	چسبندگی لایه ها به زیر لایه ها	۶۴
۲-۳	نتایج طیف سنجی مرئی - فرابنفش.....	۶۴
۳-۳	تصاویر SEM سطح لایه های کادمیم سلنید	۶۸
۴-۳	تجزیه عنصری لایه نازک های کادمیم سلنید	۷۸
۵-۳	طیف XRD لایه های تهیه شده در دماهای متفاوت.....	۸۱

فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری

۱-۴	چسبندگی بلور های کادمیم سلنید به زیرلایه شیشه ای	۸۴
۲-۴	بررسی نتایج به دست آمده از طیف سنجی مرئی - فرابنفش	۸۵
۱-۲-۴	بررسی تغییرات نسبت تری اتانول آمین به کادمیم	۸۵
۲-۲-۴	بررسی تغییرات دمای حمام	۸۶
۳-۴	بررسی مورفولوژی لایه ها با استفاده از تصاویر SEM	۸۶
۴-۴	بررسی طیف های EDX	۸۸
۴-۴	بررسی ساختار بلوری لایه نازک های کادمیم سلنید.....	۸۹

فصل اول:

تئوری

بخش اول:

نیمه رساناها

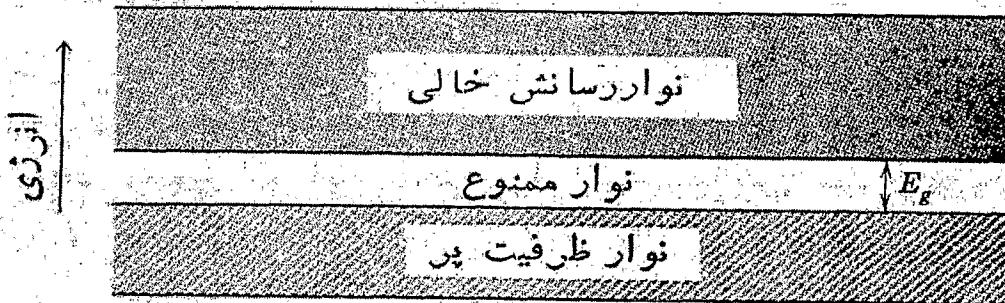
۱-۱-۱) رسانایی الکتریکی در مواد

هر جامد دارای ساختار نوار انرژی خاص خود است. این تفاوت در ساختار نوار انرژی، منشاء خواص الکتریکی متنوعی است که در مواد مختلف مشاهده می شود. به طوری که، جامدات را بر اساس قابلیت هدایت الکتریکی آنها می توانیم به سه دسته طبقه بندی کنیم. فلزات که الکتریسیته را خیلی خوب هدایت می کنند ولی بر عکس، اجسام عایق این کار را نمی کنند. عایق ها ممکن است شامل مولکولهای کوچک مجزا از هم باشند. نظیر، فسفر تری یدید که در آن انرژی لازم برای جدا کردن یک الکترون از یک مولکول و انتقال آن به مولکول دیگر به حدی زیاد است که پتانسیل های عادی بر آن بسی اثر نداشت. بیشتر جامدات یونی نارسانا هستند بالاخره جامداتی نظیر الماس و کوارتز که دارای تعداد بسیاری پیوند کووالانسی هستند، معمولاً عایق های خوبی می باشند. سومین دسته جامدات مرکب از گروه معروف به نیمه رساناها است. اینها یا عناصری هستند که روی خط مرزی بین فلزات و غیر فلزات قرار دارند نظیر سیلیسیم، ژرمانیم یا ترکیباتی هستند که از این عناصر تشکیل شده اند نظیر گالیم آرسنید و یا ساختمانهای غیر استوکیو متري گوناگون و یا ناقصی دارند. از لحاظ خواص الکتریکی این اجسام بین رساناها و نارساناها (عایق ها) قرار گرفته اند [۴]. رسانایی مواد به ساختار نوار انرژی مربوط به باندهای هدایتی و ظرفیتی آنها بستگی دارد [۱]. یک طرح نواری الکترونی که به رسانایی منجر می شود در شکل (۱-۱) نشان داده شده است. نوار رسانش در صفر درجه مطلق خالی است و به اندازه شکاف انرژی E_g از نوار ظرفیت فاصله دارد. شکاف نواری اختلاف انرژی بین پایین ترین نقطه نوار رسانش و بالاترین نقطه ظرفیت است. پایین ترین نقطه نوار رسانش

را لبه نوار رسانش می نامند و بالاترین نقطه در نوار ظرفیت به لبه نوار ظرفیت موسوم

است [۵].

برای ایجاد جریان در بلور اگر یک میدان الکتریکی اعمال کنیم هیچ انتقالی نمی تواند در توزیع الکترونی صورت گیرد. مگر آنکه منطقه ها آنقدر بهم نزدیک باشند، که الکترونهای واقع در قله بالاترین منطقه پر شده، بتوانند با کسب انرژی اضافی کافی از شکاف انرژی ممنوع عبور کرده و حالتها ای انرژی مجاز ته منطقه بعدی را اشغال کنند. در مرور مواد عایق این شکاف انرژی در حدود چندین الکترون. ولت است، برانگیزش به نوار بعدی نمی تواند به آسانی صورت گیرد. در نتیجه جریانی نمی تواند شارش کند. در مواد نیمه رسانا این شکاف انرژی خیلی بزرگ نیست در حدود ۱ الکترون ولت و یا قادری بیشتر و کمتر است تعداد کمی از الکترونها می توانند در دمای اتاق بر آنگیخته و از شکاف انرژی عبور کنند. در نتیجه، جریان کوچکی می تواند شارش یابد [۳].



شکل (۱-۱): طرح نواری برای رسانایی ذاتی در نیمه رساناها

در فلزات نوارها یا همپوشانی کرده یا اینکه فقط بطور نسبی پرشده اند. بنابراین، الکترونها و حالتهای خالی انرژی در درون نوارها در هم آمیخته اند به طوری که الکترونها می توانند آزادانه تحت تاثیر یک میدان الکتریکی حرکت کنند [۲].

۱-۱-۲) نیمه رساناها

مواد نیمه رسانا در صفر کلوین اساسا همان ساختار عایق‌ها را دارا هستند. یک نوار ظرفیت پر، که توسط یک شکاف انرژی فاقد هر گونه حالت مجاز انرژی، از نوار هدایت خالی جدا شده است. که اندازه شکاف E_F در نیمه رساناها خیلی کوچک‌تر از عایق هاست. ژرمانیم و سیلیسیم مهم ترین عناصر نیمه رسانا به شمار می‌آیند. اتم آزاد این عناصر در پوسته نیمه پر بیرونی (در حالت‌های s, p) چهار الکترون دارند. در جامد، این اتم‌ها با چهار اتم دیگر (همسایه) پیوند کوالانسی دارند. ترازهای s, p مخلوط‌اند و یک نوار ظرفیت کاملاً پر را تشکیل می‌دهند. فاصله نوار رسانش تا نوار ظرفیتی در ژرمانیم 7.8 eV و در سیلیسیم 11.1 eV است [۳]. شکافهای انرژی نسبتاً کوچک در نیمه رساناها، امکان بر انگیزش الکترون‌ها از نوار پایینی (ظرفیت) به نوار بالایی (هدایت) را با مقدار کافی از انرژی نوری یا گرمایی فراهم می‌سازد [۲].

۱-۱-۳) رسانایی الکتریکی در نیمه رساناها

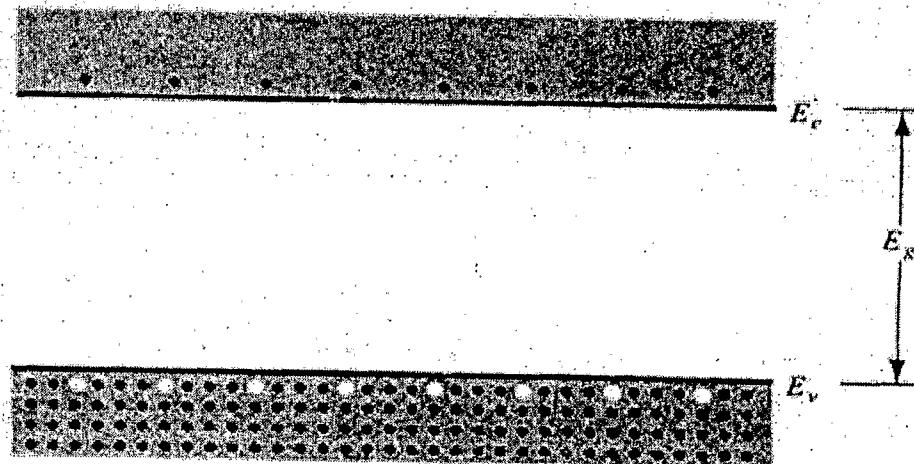
تجسم مکانیسم رسانش جریان در مورد یک فلز نسبتاً ساده است. اتم‌های فلز در دریایی از الکترون‌های نسبتاً آزاد فرو رفته‌اند و این الکترون‌ها می‌توانند به صورت گروهی تحت تاثیر یک میدان الکتریکی حرکت کنند. این تصویر از الکترون‌های آزاد بیش از حد ساده است. ولی، بسیاری از خواص مهم هدایت در فلزات را می‌توان از همین مدل ساده استخراج کرد. در عین حال، همه خواص الکتریکی یک نیمه رسانا با این روش توجیه پذیر نیست. از آنجایی که نیمه رسانا در صفر درجه دارای یک نوار ظرفیت پر و یک نوار هدایت

حالی است، باید افزایش الکترون های نوار هدایت نا شی از بر انگیختگی های گرمایی و عبور الکترونها از شکاف نوار را در موقع بالا رفتن دما در نظر بگیریم. به علاوه، پس از بر انگیزش الکtron ها به نوار هدایت، حالت های خالی باقی مانده در نوار ظرفیت نیز می توانند در فرایند هدایت شرکت کنند. همچنین، وارد کردن ناخالصی ها اثر مهمی بر روی ساختار نوار انرژی دارد.

۱-۴) الکترون ها و حفره ها

با بالارفتن دمای یک نیمه رسانا از صفر کلوین، برخی از الکترون های نوار ظرفیت انرژی گرمایی کافی برای برانگیخته شدن به نوار هدایت را به دست می آورند. حاصل، ماده ای با تعدادی الکترون در یک نوار هدایت تقریباً خالی و تعدادی حالت اشغال نشده در یک نوار ظرفیت تقریباً پر است (شکل ۱-۲) برای سهولت، از یک حالت خالی در نوار ظرفیت به عنوان حفره یاد می شود. اگر الکترون نوار هدایت و حفره بر اثر برانگیختگی الکترون از نوار ظرفیت به نوار هدایت به وجود آیند، آن ها را زوج الکترون- حفره (یا به طور مخفف EHP^۱) می نامند. بعد از برانگیزش به نوار هدایت، الکترون توسيط تعداد زیادی حالت انرژی اشغال نشده احاطه می شود به عنوان مثال، تعداد حالت تعادل زوج های الکترون- حفره در سیلیسیم خالص در دمای معمولی تنها در حدود 10^{11} EHP/cm³ است. که در مقایسه با چگالی اتم سیلیسیم (10^{22} Atom/cm³) بسیار اندک است. پس الکترون های کم تعداد در نوار هدایت، آزادانه می توانند از طریق تعداد زیادی حالت های خالی

موجود به اطراف حرکت کنند. مساله انتقال بار در نوار ظرفیت با حدودی پیچیده تر است. با این وجود، می‌توان نشان داد که آثار جریان در یک نوار ظرفیت شامل حفره‌ها به سادگی با دنبال کردن رد حفره‌ها قابل توجیه است.

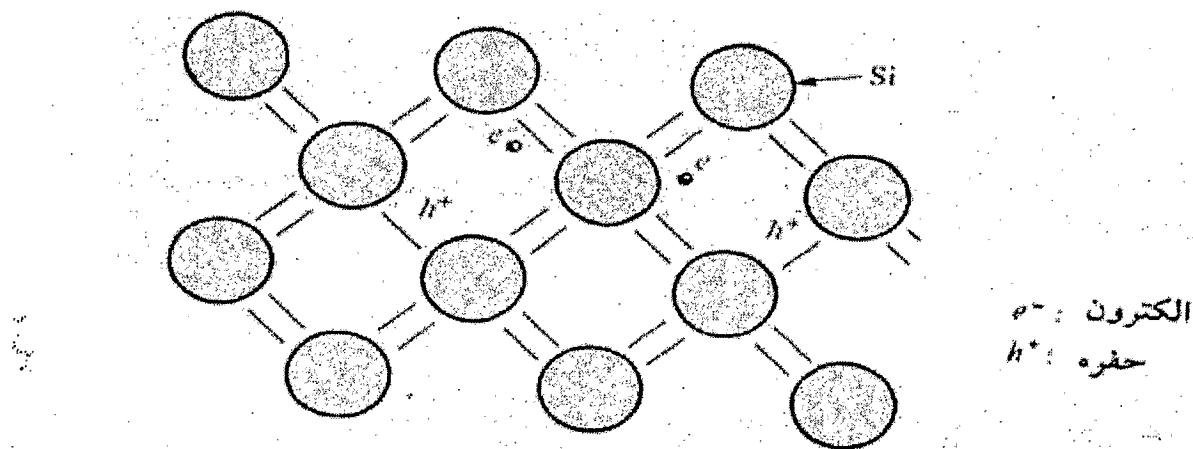


شکل (۲-۱) زوج‌های الکترون-حفره در یک نیمه رسانا

۱-۵) نیمه رساناهای ذاتی

یک بلور نیمه رسانای کامل و فاقد هر گونه ناخالصی یا ناقائص بلوری، به نام نیمه رسانای ذاتی شناخته می‌شود. در چنین ماده‌ای، هیچ گونه انتقال دهنده بار در صفر کلوین وجود ندارد. زیرا نوار ظرفیت از الکترون‌ها پر شده و نوار هدایت، خالی است. در دماهای بالاتر با برانگیزش گرمایی الکترون‌های نوار ظرفیت به نوار هدایت زوج‌های الکترون-حفره تولید می‌شود. این EHP‌ها تنها باربرهای موجود در ماده ذاتی هستند. تولید EHP را می‌توان به روش کیفی و با در نظر گرفتن گسیختگی پیوند‌های کوالانس در شبکه بلور، در شکل (۳-۱) تجسم نمود. اگر یکی از الکترون‌های ظرفیت سیلیسیم از محل خود در

ساختمان پیوند کنده شده و بتواند آزادانه در شبکه حرکت کند، یک الکترون هدایت به وجود آمده و یک پیوند شکسته شده (حفره) باقی می ماند. انرژی لازم برای شکستن پیوند برابر با انرژی شکاف نوار E_g است. این مدل به تجسم مکانیسم فیزیکی تولید EHP کمک می کند ولی برای مقاصد محاسباتی کمی، مدل نوار انرژی سودمند تر است. یک



شکل (۳-۱) : زوج های الکترون- حفره در مدل پیوند کووالانسی از بلور Si

مشکل مهم در مدل پیوند شکسته شده، این است که به طورگول زننده ای به نظر می رسد الکترون آزاد و حفره در فضاهای متعدد بین شبکه ای پخش شده در صورتی که باید به صورت مکانیک کوانتومی و با توزیع احتمالات در نظر گرفته شود. به دلیل تولید زوج الکترون ها و حفره ها، تراکم n از الکترون های نوار هدایت (تعداد الکترون ها در هر سانتی متر مکعب)، برابر با تراکم p از حفره هادر نوار ظرفیت (تعداد حفره هادر هر cm^3) است. هریک از این تراکم باربرهای ذاتی را معمولاً با n_i نمایش می دهند. پس برای

$$n = p = n_i \quad \text{ماهی ذاتی:}$$

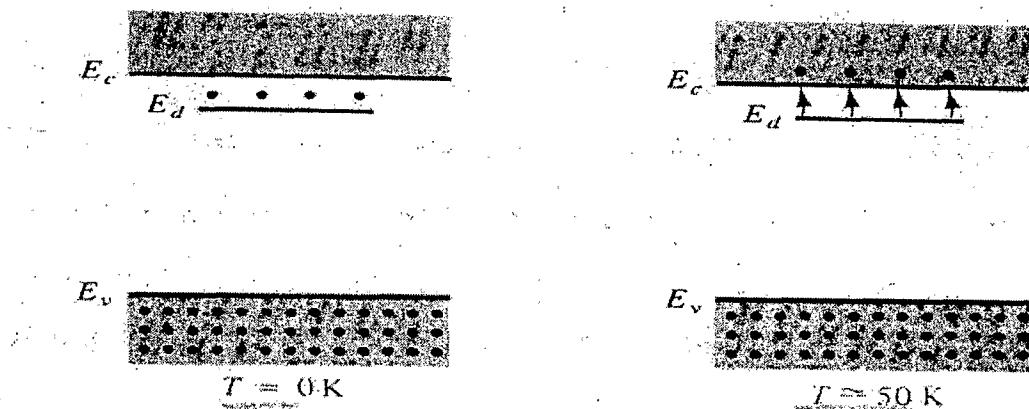
۱-۱-۶) نیمه رسانا های غیرذاتی

علاوه بر حامل های ذاتی تولید شده با گرماء، می توان با وارد کردن تعدادی ناخالصی به بلور، باربرهای اضافی در نیمه رساناها بوجود آورد. این فرایند، موسوم به آلایش، متداول ترین روش برای تغییر رسانایی در نیمه رسانا هاست. با عمل آلایش می توان بلور را طوری تغییر داد که دارای اکثربیتی از الکترون ها یا حفره هابشود. پس توسط آلایش دو نوع نیمه رسانا بوجود می آید: نوع n (اکثربیت الکترونی) و نوع p (اکثربیت حفره ای). هنگامی که بر اثر آلایش در یک بلور، تراکم حالت تعادل حامل های آن n و p با تراکم ذاتی حاملهای n; تفاوت داشته باشد، گوییم ماده غیرذاتی است. موقعی که ناخالصی یا نقص های شبکه در یک بلور تقریبا کامل وارد می شوند، ترازهای اضافی در ساختمان نوار انرژی و معمولاً درون شکاف نوار ایجاد می شود. مثلاً یک ناخالصی از ستون پنجم جدول تناوبی (P، As، Sb) تولید یک تراز انرژی در نزدیکی نوار هدایت از Si یا Ge می کند. این تراز در صفر کلوین توسط الکترون ها پر شده و انرژی گرمایی خیلی کمی برای برانگیختن این الکترونها به نوار هدایت لازم است (شکل ۱-۴). بنابراین در دماهای بیش از $k = 50 - 100$ تمام الکترون ها در تراز ناخالصی در واقع به نوار هدایت بخسیده می شوند. یک چنین تراز نا خالص را تراز دهنده و ناخالصی های ستون پنجم در Si یا Ge را ناخالصی های دهنده می نامند. از شکل (۱-۴) مشخص است که ماده دارای ناخالصی های دهنده، می تواند حتی در دماهای خیلی کم که تراکم حامل های ذاتی EHP قابل توجه نیست، تراکم قابل ملاحظه ای از الکترونها در نوار هدایت داشته باشد.

بنابراین نیمه رساناهای ناخالص شده، با تعداد قابل توجهی اتم دهنده دارای (n_i, p°)

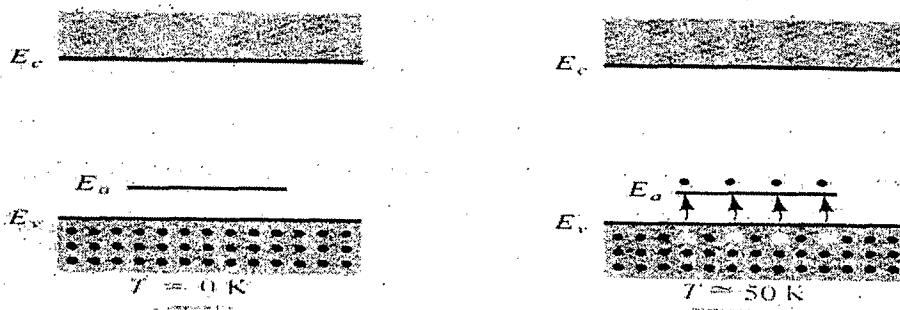
در دمای معمولی بوده و یک ماده نوع n° محسوب می شوند.

اتم های ستون سوم (In, Ga, Al, B) در Ge یا Si، ترازهای ناخالصی در نزدیکی نوار ظرفیت بوجود می آورند شکل (۱-۵). در دمای پایین، الکترون های نوار ظرفیت، انرژی گرمایی کافی برای رفتن به تراز ناخالصی و بر جای گذاشتن حفره هایی در نوار هدایت را دارا هستند. از آنجایی که این تراز ناخالصی الکترونها را از نوار ظرفیت می پذیرد، به آن



شکل (۱-۴): بخشش الکترون ها از یک تراز دهنده به نوار هدایت

تراز گیرنده و ناخالصی های ستون سوم را ناخالصی های گیرنده یا پذیرنده در Ge یا Si می نامند همانطور که شکل (۱-۵) نشان می دهد، آلایش بوسیله ناخالصی های پذیرنده، می تواند یک نیمه رسانا با تراکم حفره (p°) خیلی بیشتر از تراکم الکترون های نوار هدایت (n°) بوجود آورد (که یک ماده نوع p° نامیده می شود) [۳].



شکل (۱-۵) : پذیرش الکترون های نوار ظرفیت توسط یک تراز پذیرنده و تولید حفره های حاصل از آن